



## Tárgytematika

<b>Félév:</b>	2010/11/2
<b>Tárgynév:</b>	Korszerű felületvizsgálati módszerek laborgyakorlat
<b>Tárgykód:</b>	VEMKSIM333F
<b>Felelős szervezet neve:</b>	Anyagmérnöki Intézet (+NMR Laboratórium)
<b>Felelős szervezet kódja:</b>	MKSI
<b>Tárgyfelelős neve:</b>	dr. Kovács Kristóf

---

### Oktatás célja:

A hallgatók megismerjék a korszerű felületvizsgáló módszerek elméletét és gyakorlatát.

### Tantárgy tartalma:

Anyag és elektromágneses sugárzás kölcsönhatásán alapuló felületvizsgáló módszerek: - Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) - Auger-elektron spektroszkópia (AES) Anyag és elektronsugár kölcsönhatásán alapuló módszerek - Elektronok behatolása szilárd anyagba - Rugalmas (LEED, RHEED, THEED) és rugalmatlan (EELS) kölcsönhatások - Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) - Mennyiségi elemzés elektronsugaras Röntgen-mikroanalizátor (EPXMA) segítségével Korszerű mikroszkópiás technikák - Pásztázó alagútmikroszkópia (STM) - Atomerő mikroszkópia (AFM)

### Számonkérési és értékelési rendszere:

A gyakorlatok látogatása.

### Kötelező és ajánlott irodalom:

R.Kellner, J. - M. Mermet, M. Otto and H. M. Widmer (Eds.): Analytical Chemistry, Wiley-VHC Verlag GmbH, Germany, 1998.